1

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公司登号 特別2000 — 264941 (P2000 — 264941A)

(43)公開日 平成12年9月28日(2400.9.28)

		(
(51) Int Cl.7 C 0 8 G 8/04	識別記号	F1 C08G 8/04	7-7]-} (参考) 2H0 2 5
61/00	2	61/02	4 J 0 3 1
85/00		85/00	4 J 0 3 2
G03F 7/0	32	G03F 7/032	4 J 0 3 3
		を主記求 未請求 請求項の	枚3 OL 全5頁)
(21) 出願證号	特數平11-69880	(71)出職人 000002141 住友ペークライトも	表式会社
(22) 出頭日	平成11年3月16日(1999.3.16)	東京都品川区東品	2丁首5番 3号
	•	(72) 発明者 天野 浩治	
		東京都基川区東基ノベークライト株式	2丁目5番 3号 住友 社内
		(72) 発明者 村山 三業	1
		東京都品川区東品 ペークライト株式:	2丁目5番 8号 住友 全世内
			.
			最終質に絞ぐ

(54) 【発明の名称】 フォトレジスト用ノボラック樹脂の製造方法

(57)【要約】

【課題】 アルカリ溶解速度が充分に制御され、その結果線幅が 0.30 μmと言う極めて微細なパターン形成を可能とする、ポジ型フォトレジスト用ノボラック樹脂を提供する。

【解決手段】 フェノール類とアルデヒド類とを、芳香族炭化水素または脂肪族炭化水素を溶媒として使用し、 圧力容器中、150℃以上の温度で反応させて得られる 生成物を、架橋剤を用いて架構反応させる。

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フェノール類とアルデヒド類とを、無極性溶媒中、高温高圧下で反応させて得られる生成物を、 架橋剤を用いて架橋反応させることを特徴とする、フォ トレジスト用ノボラック樹脂の製造方法。

【請求項2】 フェノール類とアルデヒド類とを、芳香族炭化水素または脂肪族炭化水素を溶媒として使用し、 圧力容器中、150℃以上の湿度で反応させて得られる 生成物を、架橋剤を用いて架橋反応させることを特徴と する、フォトレジスト用ノボラック樹脂の製造方法。

【請求項3】 架橋剤がアルデヒド類、またはフェノール類のジメチロール体であることを特徴とする、請求項1または請求項2記載のフォトレジスト用ノボラック樹脂の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フォトレジスト用 ノボラック樹脂の製造方法、特に高感度、且つ高解像度 のフォトレジスト用ノボラック樹脂の製造方法に関する ものである。

[0002]

【従来の技術】i線(波長365mm)を露光光源とするポジ型フォトレジストは、アルカリ可溶性のノボラック樹脂(ベース樹脂)と、例えば、ナフトキノンジアジドスルホン酸エステルのような光分解性を有する感光剤から主に構成されており、IC、LSI等の半導体集積回路を製造する際のフォトリソグラフィーにおいて、エッチング保護膜として利用されている。

【0003】ポジ型フォトレジストのベース樹脂としては、特開昭62-35349号公報に見られるような、m-クレゾールとp-クレゾールからのクレゾールノボラック樹脂や、特公平6-90441号公報に見られるような、キシレノール変性ノボラック樹脂が代表的である。

【0004】しかし近年、この半導体集積回路の製造において、IC、LSI等の高集積化がますます進み、より微細なパターン形成が要求されており、フォトリソグラフィー技術の発達と共に、使用されるフォトレジストのより高性能化が必要不可欠となっている。 i 稼魃光光源については、超解像技術と称される手法が開発され、それと共にフォトレジストには、線幅が0.30μmのパターン形成が可能であることが要求されている。この線幅が0.30μmという極めて微細なパターン形成を実現するためには、フォトレジストに対して非常に高い性能が要求され、この性能を満たすために、これまでにペース樹脂であるノボラック樹脂の改良や感光剤の探求が行なわれてきた。

【0005】その中で、特開昭60-159846号公 橋させて分岐させると言う方法により、従来のフォトレ報では、フェノール類とホルムアルデヒドを、亜鉛など ジスト用樹脂に比べて構造をより高度に制御することができ の二価金属の有機酸塩を触媒に用いて、pH=4~7の 50 でき、その結果アルカリ溶解遠度を制御することができ

条件下で付加縮合させて合成した、核間メチレン結合の オルソ結合/パラ結合の比率が高いノボラック樹脂(ハイオルソノボラック樹脂)を、フォトレジストのベース 樹脂に用いることによって、高性能化をはかっている。 しかし、ハイオルソノボラック樹脂をベース 対脂として 含むポジ型フォトレジストは、露光部と未露光部とアルカリ溶解速度の差が大きいとはされるものの、アルカリ溶解速度が樹脂の分子量に大きく依存しているため、その溶解速度の制御は困難になっている。

【0006】アルカリ溶解速度の制御には、所定の分子量、分子量分布を有するハイオルソノボラック樹脂を合成する必要があるが、実際にはその合成は難しく、前記特開昭60-159846号公報に示される方法によっても、未だ充分にアルカリ溶解速度を制御できるまでには至っていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、アルカリ溶解速度が充分に制御され、その結果線幅が 6.30 μ ω と 言う極めて微細なパターン形成を可能とする、ポジ型フォトレジスト用ノボラック樹脂を提供することを目的と する。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成すべく鋭意研究を行なった結果、フェノール類とアルデヒド類とを、無極性溶媒中、高温高圧下で反応させて得られる生成物を、架橋剤を用いて架橋反応させることにより、線幅が0.30μmと言う極めて敬和なパターン形成を可能とする、ポジ型フォトレジスト用ノボラック樹脂が得られることを見い出し、さらに検討を進めて本発明を完成するに至ったものである。

【0009】即ち本発明は、フェノール類とアルデヒド類とを、芳香族族化水素または脂肪族族化水素を容禁として使用し、圧力容器中、150℃以上の温度で反応させて得られる生成物を、架橋剤を用いて架橋反応させることを特徴とする、フォトレジスト用ノボラック樹脂の製造方法である。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明においては、先ず、フェノール類とアルデヒド類とを、無極性溶媒中、高温高圧で反応させて、直鎖状、または極めて分岐の少ない形状のハイオルソノボラック樹脂を合成し、次に、アルデロール類のジメチロール体を用いて、ことに現のイオルソノボラック樹脂を架橋し、分岐で高感度に実現が、線幅が0.30μmのパターン形成を高感度に実現が、線幅が0.30μmのパターン形成を高感度に実現が、きる、フォトレジスト用ノボラック樹脂を得る。アルカリ溶解速度の制御の難しいハイオルソノボラックを、を表し、直鎖状または分岐の少ない構造に合成であって、中間に比べて構造をより高度に制御することができ、その結果アルカリ溶解速度を制御することができ、その結果アルカリ溶解速度を制御することができ、その結果アルカリ溶解速度を制御することができ

るに至ったと推測される。

【0011】本発明において使用するフェノール類としては、フェノール、クレゾール、キシレノール、エチルフェノール、tープチルフェノール、トリメチルフェノール、レゾルシノール等が挙げられるが、中でもm-クレゾール、p-クレゾール、3.5ーキシレノールのように、2つのオルソ位に置換基が導入されていないものが好ましい。

【0012】また、アルデヒド類としては、ホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベロンズアルデヒド、クロトンアルデヒド等が使用できるが、特にホルムアルデヒドや、パラホルムアルデヒドのように、嵩高い置換基のついていないものが好ましい。 【0013】無極性溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素や、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素が使用可能である。

【0014】無極性溶媒中における高温高圧反応時の温度は、150℃以上で、好ましくは180~220℃、圧力は、その反応温度における溶媒の飽和蒸気圧である 20 ことが好ましく、必要に応じて溶媒の飽和蒸気圧以上に加圧しても構わない。また、アルデヒド類とフェノール類とのモル比は、0.5~1.2、好ましくは0.85~0.9の範囲とするのが良い。溶媒とフェノール類の重量比は、0.1以上であれば良いが、3~15とするのが好ましい。

[0015]本発明によって製造される樹脂の、核間メ チレン結合のオルソ結合/パラ結合の比は、2.5以上 が好ましく、また、重量平均分子量は3500~200 00が好ましい。

【0016】一方、本発明において使用する架橋剤としては、前記のアルデヒド類や、例えば2,6ーピス(ヒドロキシメチル)ーpークレゾール(pークレゾールのジメチロール体)のような、フェノール類の芳香環に求電子置換反応、あるいは求核環境反応を起こす置換基を複数有するものが挙げられる。添加する架橋剤の量としては、高温高圧反応時に仕込むフェノール類に対して、モル比で0.01~0.5であり、0.05~0.2が好ましい。架橋反応を促進するために必要に応じて触媒を添加することもできる。また、架橋反応時の温度は150 ↔ ℃以下であり、室温~100℃が好ましい。

【0017】また、感光成分としてはキノンジアジド化合物を用いる。キノンジアジド化合物の種類は、特に限定されるものではないが、例えば1,2ーペンゾキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1,2ーナフトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1,2ーナフトキノンジアジドー6ースルホン酸エステルなどを挙げることができる。これらのキノンジアジド化合物とノボラック樹脂の配合比は、1:1~1:6の範囲で用いるのが好ましい。

【0018】本発明のフェノール樹脂を用いるフォトレジスト液の調製は、ノボラック樹脂とキノンジアジド化合物の濃度が5~50重量%となるように、均一で平滑な強膜を与える溶剤に混合溶解することによって行なう。レジストの調製に適した溶剤としては、乳酸エチル、メチルセルソルブ、エチルセルソルブ、メチルセルソルブアセテート、エチルセルソルブアセテート、メトキシプロピルアセテート、乳酸・ロープチル、メテルイソブチルケトン、キシレン等が挙げられる。これの他さらに、必要に応じて界面活性剤、保存安定剤、染料などを添加することもできる。

[0019]

【実施例】以下に、実施例を挙げて本発明者具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって何ら制約されるものではない。

【0020】《実施例1》提弁機、熱交換機、温度センサー、圧力計、および安全弁を装備した、容量10Lのオートクレーブに、エークレゾール400部、pークレゾール100部、パラホルムアルデヒド(純度88%)138部、およびキシレン5000部を仕込んで、200℃±2℃まで昇湿させ、6時間その温度に保持した。80℃まで反応液を冷却した後、パラホルムアルデヒド14部と蓚酸5部を加え、80℃±2℃に3時間保持した。減圧下でキシレン及び未反応クレゾールを留去し、ノボラック樹脂を得た。NMRにより求めた核間メチレン結合のオルソ結合/パラ結合の比は、4~4であった。また、GPCにより求めた重量平均分子量は4700、分子量分布は2.7であった。

【0021】《実施例2》実施例1と同じオートクレー30 ブに、m-クレゾール200部、3,5-キシレノール226部、p-クレゾール100部、パラホルムアルデヒド(純度88%)138部、およびキシレン5000部を仕込んで、200℃±2℃まで昇温させ、6時間その温度に保持した。80℃まで反応液を冷却した後、パラホルムアルデヒド14部と蓚酸5部を加え、80℃±2℃に3時間保持した。減圧下でキシレン、未反応クレゾール及び未反応キシレノールを留去し、パブラック樹脂を得た。NMRにより求めた核間メチレン結合のオルソ結合/パラ結合の比は、4.5であった。GPCにより求めた重量平均分子量は6400、分子量分布は3.2であった。

【0022】《実施例3》実施例1と同じオートクレープに、mークレゾール400部、pーク・ゾール100部、パラホルムアルデヒド(純度88%)138部、およびキシレン5000部を仕込んで、200℃±2℃まで昇温させ、6時間その温度に保持した。80℃まで反応液を冷却した後、2,6ービス(ヒドロキシメチル)ーpークレゾール78部と蘇酸5部を加た、80℃±2℃に3時間保持した。減圧下でキシレン及び未反応クレゾールを密去し、ノボラック樹脂を得た。NMRにより

(4)

求めた核間メチレン結合のオルソ結合/パラ結合の比は、4.7であった。GPCにより求めた重量平均分子量は5600、分子量分布は2.9であった。

【0023】《比較例1》接弁機、温度計、環流管、および逐添装置のついた3Lの4つロフラスコに、mークレゾール400部、pークレゾール100部、および蘇酸1部を仕込んで、100℃まで昇温させた後、37%ホルマリン308部を、逐添装置を使用して1.5時間で逐添した後、環流温度で1時間反応させた。常圧下で130℃まで加熱して脱水した後、減圧下で未反応クレゾールを除去し、ノボラック樹脂を得た。NMRにより求めた核間メチレン結合のオルソ結合/パラ結合の比は、1.5であった。GPCにより求めた重量平均分子量は4600、分子量分布は4.1であった。

【0024】《比較例2》比較例1と同じ3Lの4つロフラスコに、mークレゾール200部、3,5ーキシレノール226部、pークレゾール100部、および蓚酸1部を仕込んで、100℃まで昇温させた後、37%ホルマリン308部を、逐蒸装置を使用して1.5時間で逐添した後、還流温度で1時間反応させた。常圧下で130℃まで加熱して脱水した後、減圧下で未反応クレゾール及び未反応キシレノールを除去し、ノボラック樹脂を得た。NMRにより求めた核間メチレン結合のオルソ結合/パラ結合の比は、1.6であった。GPCにより求めた重量平均分子量は5300、分子量分布は4.3であった。

【0025】《比較例3》比較例1と同じ3Lの4つ口 フラスコに、mークレゾール400部、p-クレゾール 100部、酢酸亜鉛1部を仕込んで、100℃まで昇退 させた後、37%ホルマリン308部を、逐添装置を使 30 用して1.5時間で逐添した後、還流沮度で1時間反応 *

*させた。常圧下で130℃まで加熱して脱水した後、減 圧ドで未反応クレゾールを除去し、ノボラック樹脂を得 た。NMRにより求めた核間メチレン結合のオルソ結合 ノパラ結合の比は、2.5であった。GPCにより求め た重量平均分子量は4900、分子量分布は4.1であった。

【0026】実施例1~3、および比較例1~3で得られたノボラック樹脂100重量部を、ナフトキノン1,2ージアジドー5ースルホン酸の2,3.4~トリヒドロキシベンソフェノンエステル30重量部と丼に、エチルセルソルプアセテート400重量部に溶解し、レジスト液を調合した。これらの各組成物を0.2μπのメンプレンフィルターを用いてろ過し、レジスト液サンプルとした。

【0027】これを常法によって洗浄したシリコンウエハーに、回転途布機を用いて乾燥途膜1.0μμ厚となるように途布した。次いで、このシリコンウエハーを110℃で90秒間ホットプレート上で乾燥させた。その後、縮小投影露光装置を用いテストチャートマスクを介して露光し、現像被(2.38%のテトラアンモニウム水溶液)を用いて50秒間現像し、水洗し上後乾燥した。

【0028】現像後のレジストバターンのついたこれらのシリコンウエハーを、130℃に設定したクリーンオーブン中に30分間放慢した後、走査型電子顕微鏡によりレジストパターンの観察を行ない、解像度、感度、及び鬱光裕度について評価した。評価結果をまとめて表1に示した。

[0029]

【表1】

表1

	解像度 (µmL&S)	感度 (m.l/cm²)	露光裕度
実施例1	0.30	220	1. 17
実施例 2	0.28	240	1. 25
実施例3	0.30	220	1. 18
比較例1	0. 35	280	1,07
比較例2	0. 33	300	1.06
比較到3	0.32	270	1.04

【0030】表1の結果から分かるように、本発明によるフェノール樹脂を用いた実施例のフォトレジストは、比較例に比べて、解像度、感度、及び露光裕度のいずれも優れた値を示した。

[0031]

【発明の効果】本発明の製造方法により得られるノボラック樹脂を配合したポジ型フォトレジストは、高感度で、解像度に優れ、線幅が0.30μmと常う極めて微細なパターンを形成することができ、半導体集積回路の一層の高集積化に役立ち有用である。

(5)

フロントページの従き

F ターム(参考) 2H025 AA00 AA01 AA02 AB16 AC01 AD03 BE01 CB29 CB51 CB56 4J031 CA06 CA12 CA13 4J032 CA03 CA04 CA06 CE03 CE06 CE12 CG01 4J033 CA01 CA02 CA03 CA05 CA11 CA12 CA13 CB02 CB03 CB25

HA02 HA12 HA21 HA23 HB10

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-264941

(43)Date of publication of application: 26.09.2000

(51)Int.Cl.

C08G B/04 COSG 51/02

COBG 85/00 GD3F 7/032

(21)Application number: 11-069880

(71)Applicant : SUMITOMO BAKELITE GO LTD

(22)Date of filing:

16.03.1999

(72)Inventor: AMANO KOJI

MURAYAMA MITSUMOTO

(54) PRODUCTION OF NOVOLAK RESIN FOR PHOTORESIST

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a novolak resin for a positive type photoresist, capable of sufficiently controlling its dissolving speed in alkali, and consequently forming such an extremely fine pattern that the line width is 0.30 $\,\mu$ m.

SOLUTION: This method for producing a novolak resin for a photoresist comprises reacting a phenol with an aldehyde using an aromatic hydrocarbon or an aliphatic hydrocarbon as a solvent at a temperature of 150° C in a pressure vessel, then subjecting the reaction product to cross inking reaction using a crosslinking agent, such as the aldehyde or a dimethylol compound derived from the phenol.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office